相位差测试仪（偏光片性能检测仪）技术规格要求

相位差测试仪主要测试原材料的位相差及配向角，中间品的正面位相差、厚度方向位相差、配向角等光学指标。

1、测试对象：偏光片、相位差膜、光学膜。可准确测试液晶补偿膜、一般补偿膜及高补偿膜的各项参数。

2、测试功能包括：面内补偿值Re、厚度补偿值Rth、光轴方向、预倾角 Beta、透过率（单体、透过、直交）、偏光度等。

除可测试Ret+Pol结构的补偿偏光片的贴合角度之外，还可测试Ret+Ret+Pol结构的补偿偏光片各层补偿膜的补偿值。

除测试单层膜外，在测试多层结构时，可单独选择多层中的补偿补偿膜进行补偿值的测试（需单层膜参数）。

3、各项参数

3.1 测试光斑：≤5mm

3.2 轴角度测试范围：0~180°

3.4 轴角度精度（相对于标准片）：慢轴±0.2°（根据计量标准制定）

吸收轴±0.05°

3.5 测量重复性：≤0.05°（此精度根据标准样品制定，因为超低相位差不存在轴角度,所以不适用于超低相位差）

3.6 相位差测量重复性：≤0.5nm

**3.7 正面位相差读数分辨率为0.01nm，**

**3.8 厚度位相差读数分辨率为0.01nm，**

**3.9 配向角读数分辨率为0.001°。**

3.10 测试波长范围： 400nm to 800nm

3.11 测试波长最小间隔： 1nm

3.12 补偿值测试范围： 0nm to 20000nm

3.13 旋转角度(方位角) ：0 to 360°或者-180°~+180°

3.14 预倾角度： -55°to+ 55°

3.15 最小角度：0.1° 速度: ＞40°/sec

4、光谱仪参数

4.1 波长精度：±0.2nm

4.2 光谱杂散光：＜0.05%（400nm）

4.3 信噪比：2000:1

5、需提供同行业绩